

電子顕微鏡セミナー

～TEM入門コース～

基本的手法の解説から装置の操作に関するやや発展的な内容まで、電子顕微鏡初学者を対象としたセミナーです。

開催概要

日 時：11/28(火) 13:30～16:50

開催形式：対面

定 員：150名(事前登録制先着順)

会 場：武田先端知ビル5F

参加費：無料

お申し込み：下記URLもしくはQRコードよりお申し込みください

<https://forms.gle/J1GKfcGt5iY3Bi848>

● お問い合わせ

東京大学・日本電子産学連携室 金子・斎藤

E-mail: skaneko@jeol.co.jp



電子顕微鏡セミナー ～TEM入門コース～ プログラム

13:30～13:35	開会挨拶、オリエンテーション	東京大学大学院工学系研究科	石川 亮
13:35～14:35	TEMの基礎について	日本電子株式会社	近藤 行人
14:35～15:00	TEMによるその場観察	日本電子株式会社 EM事業ユニット	福永 啓一
15:00～15:10	休憩		
15:10～15:35	透過電子顕微鏡JEM-F200の紹介	日本電子株式会社 EM事業ユニット	福永 啓一
15:35～16:00	TEMサンプリングについて (TEMサンプリング概略、イオンミリング法、FIB法)	日本電子株式会社 EP事業ユニット	河原 尚
16:00～16:25	最新FIB JIB-PS500iの紹介	日本電子株式会社 EP事業ユニット	柴田 昌照
16:25～16:45	質疑応答		
16:45～16:50	閉会挨拶		

※ プログラムは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

主催：東京大学・次世代電子顕微鏡法社会連携講座

共催：東京大学・日本電子産学連携室、マテリアル先端リサーチインフラ事業 (ARIM)



東京大学
次世代電子顕微鏡法
社会連携講座



東京大学・日本電子 産学連携室

The University of Tokyo - JEOL
University-Corporate Collaboration Office

